



中華民國專利證書

發明第 I 666435 號

發明名稱：露點傳感器的測試系統

專利權人：宇田控制科技股份有限公司

發明人：朱仁誠、戴振榮

專利權期間：自 2019 年 7 月 21 日至 2038 年 11 月 19 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

洪淑敏

中華民國



108

年

7

月

21

日

